

บทที่ 4

การทดสอบระบบวัดกระแสสัมผัส

มาตรฐานการทดสอบหาค่าสเกลแฟกเตอร์ (Assigned Scale Factor Test)

วิธีการทดสอบหาค่าสเกลแฟกเตอร์ที่กำหนด ตามมาตรฐาน IEC 60060-2 (1994) [5] ได้กำหนดวิธีทดสอบอ้างอิงไว้คือ ใช้วิธีการวัดเปรียบเทียบกับระบบวัดอ้างอิง โดยถ้าเป็นไปได้ให้ทดสอบที่พิกัดของระบบวัดทดสอบ ในการทดสอบอ่านค่ากระแสจากระบบวัดอ้างอิงและค่าแรงดันจากระบบวัดทดสอบ โดยจะต้องทำการทดสอบไม่น้อยกว่า n ค่า ($n \geq 10$) ซึ่งมีเงื่อนไขในการทดสอบตามที่มาตรฐานกำหนดไว้

สเกลแฟกเตอร์ที่กำหนดจะหาได้จากค่ากระแสที่อ่านได้จากระบบวัดอ้างอิงหารด้วยค่าแรงดันที่ได้อ่านได้จากระบบวัดที่ต้องการทดสอบ ซึ่งกำหนดให้เป็น F_i ส่วนค่าสเกลแฟกเตอร์ที่กำหนด F_m หาได้จากค่าเฉลี่ยของ F_i โดยที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน s คำนวณได้จาก

$$S = \sqrt{\frac{\sum (F_i - F_m)^2}{n - 1}} \quad (4.1)$$

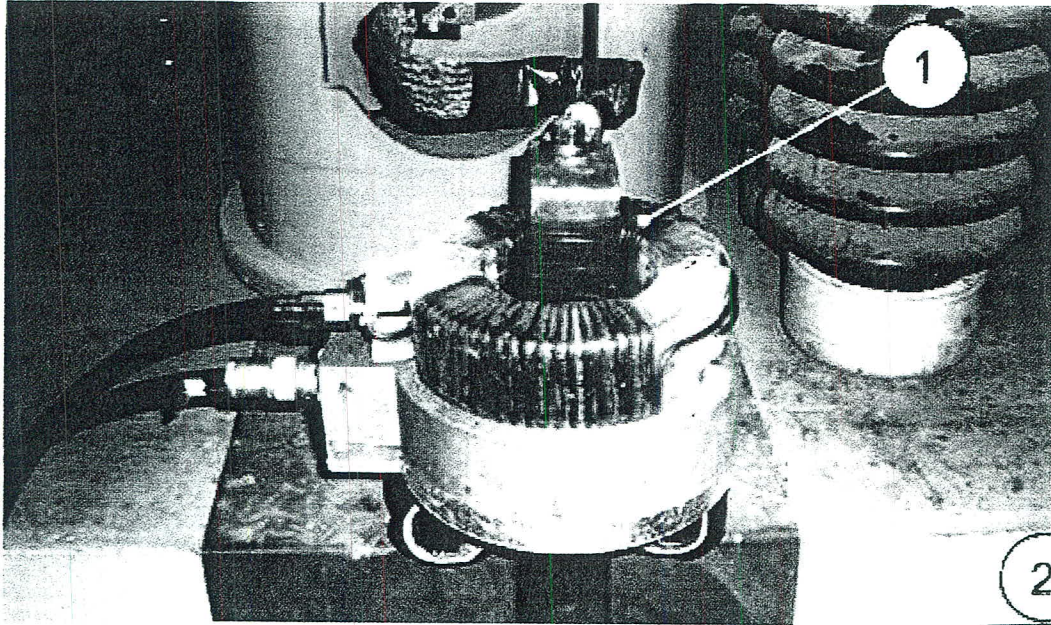
เมื่อ : S คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
 F_i คือ ค่ากระแสจากระบบวัดอ้างอิงหารด้วยค่าแรงดันจากระบบวัดที่ต้องการทดสอบ
 F_m คือ ค่าเฉลี่ยของ F_i

ตามมาตรฐาน IEC 60060-2 (1994) [5] ได้กำหนดเงื่อนไขในการทดสอบไว้ดังนี้

1. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จะต้องน้อยกว่า 1% ของ F_m
2. ค่าพารามิเตอร์ทางเวลาจะต้องอยู่ในเงื่อนไขดังนี้
 - ค่าพารามิเตอร์ทางเวลาจะต้องมีค่าไม่เกิน $\pm 10\%$ ของค่าที่วัดได้จากระบบวัดอ้างอิง
 - อัตราส่วนของค่าที่วัดได้จากระบบวัดที่ต้องการทดสอบกับระบบวัดอ้างอิงต้องมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 5% ของค่าเฉลี่ย

การทดสอบหาค่าสเกลแฟกเตอร์

เป็นการทดสอบโดยการเปรียบเทียบกับระบบวัดอ้างอิง โดยระบบวัดอ้างอิงมีสเกลแฟกเตอร์เท่ากับ 15.51 kA/1V การทดสอบทำขึ้นที่ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง



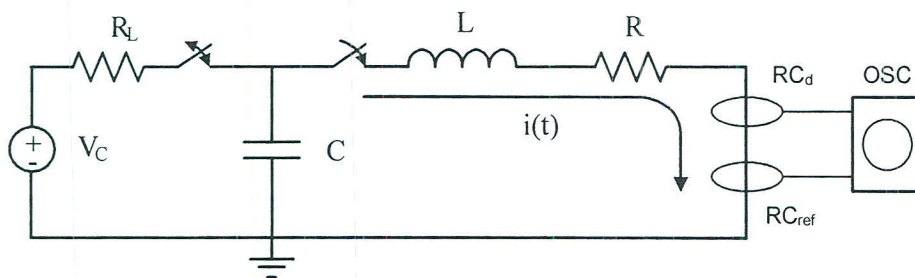
รูปที่ 14 ขดลวดเหนี่ยวนำที่ใช้ในการเปรียบเทียบ

โดยที่	หมายเลข 1	คือ ขดลวดเหนี่ยวนำที่ทำการออกแบบ
	หมายเลข 2	คือ ขดลวดเหนี่ยวนำอ้างอิง

1 การต่อวงจรทดสอบ

1.1 วงจรทดสอบ

การทดสอบหาคุณสมบัติของขดลวดเหนี่ยวนำที่ออกแบบ (RC_d) จะทำการทดสอบเปรียบเทียบกับขดลวดเหนี่ยวนำอ้างอิง (RC_{ref}) โดยใช้วงจรทดสอบแสดงดังรูปที่ 15



รูปที่ 15 วงจรสมมูลของการทดสอบ

V_C	คือ	แรงดันกระแสตรงที่จ่ายให้กับตัวเก็บประจุ
R_L	คือ	ตัวต้านทานจำกัดกระแส
C	คือ	ตัวเก็บประจุในวงจร
L	คือ	ตัวเหนี่ยวนำในวงจร
R	คือ	ตัวต้านทานในวงจร
R_{Cd}	คือ	ขดลวดเหนี่ยวนำที่ออกแบบ
R_{Cref}	คือ	ขดลวดเหนี่ยวนำอ้างอิง
$i(t)$	คือ	กระแสอิมพัลส์
OSC	คือ	ออสซิลโลสโคป

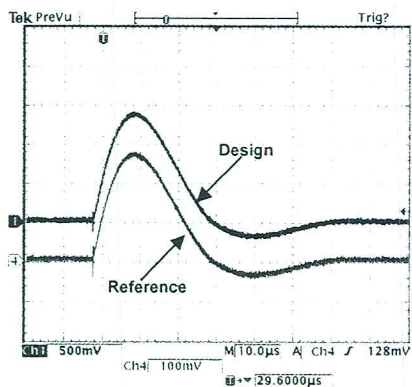
อุปกรณ์ในวงจรทดสอบประกอบไปด้วย

- 1 เครื่องกำเนิดกระแสอิมพัลส์
- 2 ขดลวดเหนี่ยวนำ
- 3 อินทิเกรเตอร์แบบตัวต้านทานและตัวเก็บประจุหลาย 3 ชั้น
- 4 ออสซิลโลสโคป

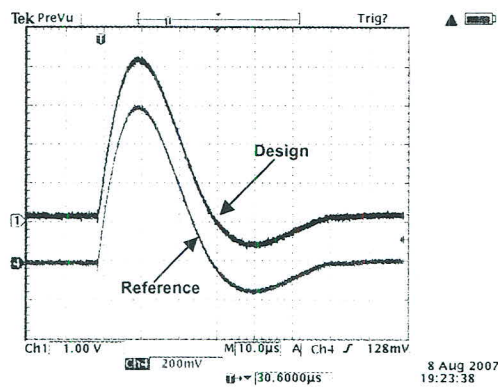
2 วิธีการทดสอบ

- 1 ต่อวงจรทดสอบดังรูปที่ 15
- 2 ทดสอบด้วยค่ากระแสอิมพัลส์ 5 ค่า คือ 4 kA, 12 kA, 28.8 kA, 42 kA และ 50.1 kA เพื่อนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับระบบวัดอ้างอิง
- 3 บันทึกผลการทดลอง

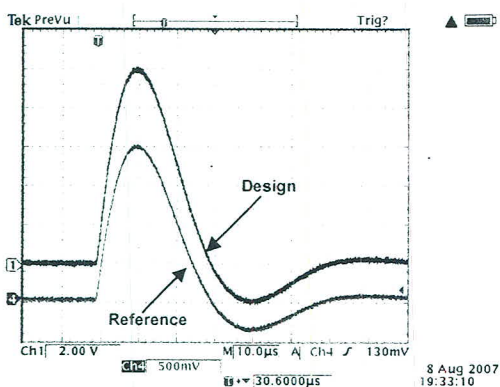
3 ผลการทดลอง



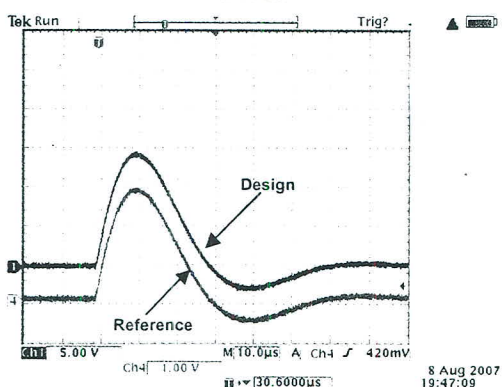
4 kA



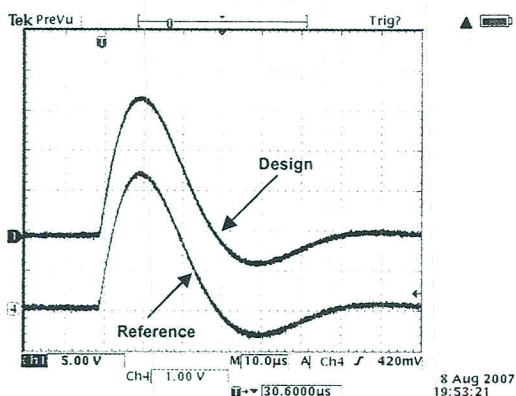
12 kA



28.8 kA



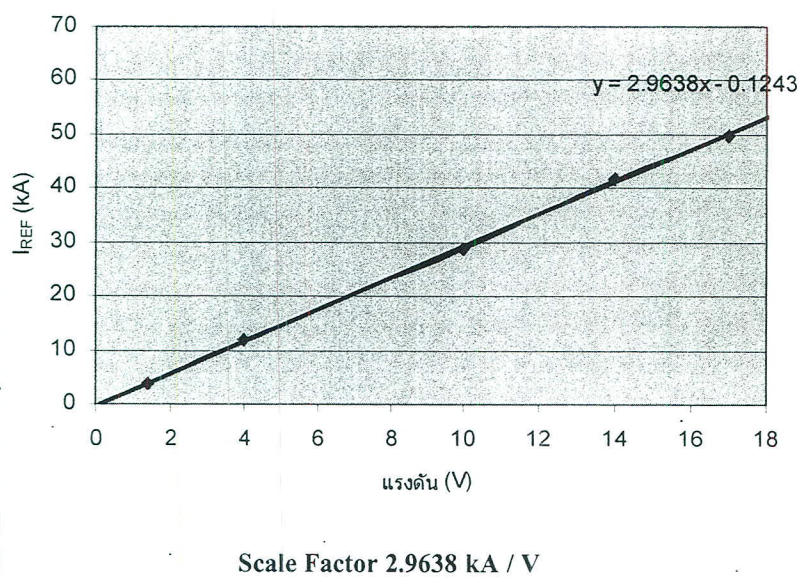
42 kA



50.1 kA

รูปที่ 16 ผลการทดลองการปรับเทียบสเกลเฟลคเตอร์

สเกลแฟกเตอร์ของระบบวัดกระแสिमพัลส์ที่ออกแบบสร้าง



รูปที่ 17 สเกลแฟกเตอร์ของระบบวัดกระแสिमพัลส์ที่ออกแบบสร้าง

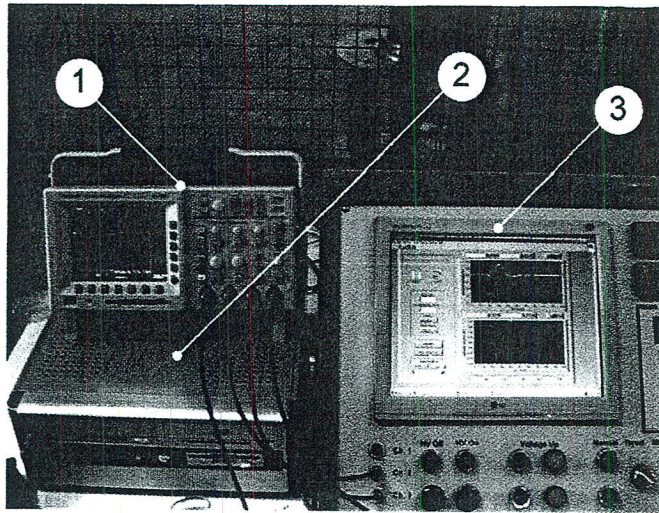
การทดสอบหองค์ประกอบของรูปคลื่นกระแสिमพัลส์

ระบบวัดกระแสที่ออกแบบสร้างขึ้นได้นำไปปรับเทียบกับระบบวัดกระแสอ้างอิงเพื่หาองค์ประกอบเฉลี่ยของรูปคลื่นกระแสिमพัลส์ โดยใช้วงจรทดสอบดังรูปที่ 4.2 – 4.3 โดยทำการทดลองป้อนกระแสिमพัลส์มาตรฐาน 8/20 μ s จากเครื่องกำเนิดกระแสिमพัลส์ ทำการทดสอบที่ขั้วบวก จะได้ผลตามตารางที่ 4.1

ตารางที่ 1 องค์ประกอบกระแสिमพัลส์รูปคลื่น 8/20 μ s ขั้วบวกที่วัดด้วยระบบวัดอ้างอิงและระบบวัดที่ออกแบบสร้างขึ้น

ค่าองค์ประกอบ	ระบบวัดอ้างอิง	ระบบวัดที่ออกแบบสร้าง	ความคลาดเคลื่อน
T ₁	7.8	7.8	0%
T ₂	21	20.8	0.952%
กระแสกลับชั่ว	18%	18%	0%

โดยที่การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปคลื่นกระแสिमพัลส์ได้วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาโดย ดร. พิรุณ ภูธรโกวิท จอภาพแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์แสดงในรูปที่ 18



รูปที่ 18 ผลการวิเคราะห์กระแสพัลส์

โดยที่

- 1 ดิจิตอลออสซิลโคป
- 2 เครื่องคอมพิวเตอร์
- 3 จอภาพแสดงผลโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น